## Тонкослойные электрохимически полученные SiO<sub>2</sub>/Ni-композиты в литиевом макетном аккумуляторе

#### \*Р. Д. Апостолова, Н. А. Мациевский, В. А. Гладун, М. О. Савченко

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», пр. Гагарина, 8, г. Днепр, 49005, Украина, <sup>\*</sup>e-mail: <u>shembel@onil.dp.ua</u>

Диоксид кремния был получен сернокислотным осаждением из водного раствора  $Na_2SiO_3 \cdot mH_2O$ . Размер частиц основной фракции синтезированного материала, установленный по изображению в электронном микроскопе, находится в пределах 12–16 нм. По данным рентгенофазового анализа получен SiO<sub>2</sub> диоксид аморфной модификации. Его использовали для синтеза тонкослойного композита SiO<sub>2</sub>/Ni электролизом с целью определения возможности применения в отрицательных электродах миниатюрных литий-ионных батарей (ЛИБ). Исследования композита SiO<sub>2</sub>/Ni в модельном литиевом аккумуляторе в гальваностатическом циклировании показали стабильное эффективное преобразование в интервале напряжения 0,40–0,15 В как свидетельство перспективности его использования в ЛИБ.

Ключевые слова: диоксид SiO<sub>2</sub>, аморфный, нанометровый композит SiO<sub>2</sub>/Ni, электролиз, литиевый аккумулятор.

УДК 544.643-621.357

#### ВВЕДЕНИЕ

Диоксид SiO<sub>2</sub> предложен как альтернативный материал с повышенной теоретической удельной емкостью (1784 мА·ч·г<sup>-1</sup>) для замены менее энергоемкого графита (372 мА·ч·г<sup>-1</sup>), используемого в отрицательных электродах коммерческих литий-ионных батарей [1]. Аморфный диоксид SiO<sub>2</sub> в виде однородных наносфер диаметром 400 нм при взаимодействии с ионами лития отдает емкость 876,7 мА·ч·г<sup>-1</sup> после 500 циклов при скорости 1 С с участием матрицы, состоящей из Si, Li<sub>2</sub>O и Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>.

Анализ литературных данных по преобразованию SiO<sub>2</sub> в литиевом аккумуляторе говорит об отсутствии единства взглядов исследователей, противоречивости сведений, мнений и необходимости дальнейшего экспериментального исследования потенциальных возможностей SiO<sub>2</sub>-электрода в литиевом аккумуляторе.

В работе [2] установлено, что слой SiO<sub>2</sub> на частицах кремния – перспективного электродного материала для будущей генерации литийионных батарей – отрицательно влияет на преобразование кремниевого электрода, замедляет транспорт ионов лития на поверхности раздела SiO<sub>2</sub>/Si, приводит к низкой оборотной емкости и повышению импеданса переноса заряда. При наложении низкого потенциала к Si-электроду оксидный слой может быстро переходить в силикатную форму в пределах 0,01–1,00 В относительно (Li/Li<sup>+</sup>). Это ведет к необратимому потреблению ионов лития с кардинальной потерей емкости в литий-ионной системе. Существование поверхностного слоя  $SiO_2$  на частицах Si не вызывает сомнения. Пути конверсии этого слоя являются спорными. Ханг и др. считают, что  $SiO_2$  инертен в процессах электрохимического циклирования в литиевом аккумуляторе [3]. Ларшэ и др. полагают, что восстановление  $SiO_2$  до Si и Li<sub>2</sub>O термодинамически вообще невозможно [4], тогда как Фульц и др., напротив, уверены в том, что восстановление диоксида  $SiO_2$  является термодинамически осуществимым процессом [5].

С помощью ядерного магнитного резонанса и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии представлены доказательства восстановления нано-SiO<sub>2</sub> в углероде с конечными продуктами Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> и Li<sub>2</sub>O [6].

Кристаллический SiO<sub>2</sub>-кварц электрохимически не активный по отношению к литию, переведенный в активное состояние с образованием Si и аморфного SiO<sub>2</sub> механо-химическим способом в высоко энергоемкой шаровой мельнице, при взаимодействии с литием обеспечивает разрядную емкость около 800 мА·ч·г<sup>-1</sup> на протяжении 100 циклов [7].

Полые наносферы SiO<sub>2</sub> со структурой ядрооболочка-корона [8], синтезированные по темплатному методу, способны стабильно отдавать емкость 330–350 мА·ч·г<sup>-1</sup> на протяжении 500 циклов в литиевом аккумуляторе с электролитом: этиленкарбонат, диметилкарбонат, (1:2 мас), 1 моль·л<sup>-1</sup> LiPF<sub>6</sub>.

В тонких поликристаллических пленках  $SiO_2$  толщиной 400 нм, массой 0,11 мг·см<sup>-2</sup>, полученных радиочастотным напылением на нержавею-

щую сталь, по данным [9], в литиевом аккумуляторе осуществляется реакция конверсии в области 3,00-0,01 В с образованием силиката Особенностью разрядно-зарядного Li<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. двухстадийного профиля является наличие горизонтально-наклонных площадок напряжения, связанных с процессами преобразования редокспар вблизи 1,00/1,75 и 0,77/1,57 В. В области потенциалов ниже 0,4 В происходит реакция сплавообразования кремния с литием. Стабильная емкость SiO<sub>2</sub>, равная 416–465 мA·ч· $\Gamma^{-1}$ , на протяжении 100 циклов обязана обратимому гетерогенному разложению SiO<sub>2</sub> в редоксреакции с литием с образованием Li<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

При сравнении разрядных характеристик макетного литиевого аккумулятора на основе электрохимически синтезированного сульфида FeS и его композиции с SiO<sub>2</sub> установлено, что разрядная емкость тонкослойного композита FeS/SiO<sub>2</sub> увеличивается на 30–40% по сравнению с таковой тонкослойного чистого FeS, что дает возможность эффективного использования композита в электродах литиевого аккумулятора и литий-ионной системы [10].

В данной работе предложен электрохимический синтез тонкослойного композита SiO<sub>2</sub>/Ni и показаны особенности электрохимического взаимодействия его с литием. Получение композита в тонких слоях представляет интерес для совершенствования микроаккумуляторов, широко востребованных в миниатюрных электронных устройствах (смарт-картах, микророботах, микросенсорах и др.).

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

#### Синтез SiO<sub>2</sub>

Диоксид SiO<sub>2</sub> получен по способу сернокислотного осаждения из раствора натриевого жидкого стекла Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>·mH<sub>2</sub>O с плотностью 1,08 г.см<sup>-3</sup>. Серную кислоту добавляли по каплям в течение 10 минут в раствор жидкого стекла с температурой 80-95°С при принудительном перемешивании (650 обор мин<sup>-1</sup>) до достижения величины pH раствора ~ 10,0÷9,6. После паузы 60÷70 мин подачу кислоты возобновляли и за 2-3 мин доводили pH до ~ 3,0÷2,0 при интенсивосаждении SiO<sub>2</sub>. После разбавления ном образовавшейся суспензии горячей водой (50÷60°С), фильтрации с помощью воронки Бюхнера, отмывки от натрий- и сульфат-ионов осадок SiO<sub>2</sub> сушили при 105°С и измельчали в фарфоровой ступке.

#### Синтез композита SiO<sub>2</sub>/Ni

Синтезированный диоксид SiO<sub>2</sub> использовали для гальванического получения композита SiO<sub>2</sub>/Ni. Тонкослойный композит осаждали на катоде из никелевой фольги в электролизере емкостью 200 см<sup>3</sup> с никелевым анодом. Катод располагали горизонтально, и суспензию из SiO<sub>2</sub> в электролите для никелирования при тщательном перемешивании вливали в электролизер. После заполнения электролизера электролитом следовала пауза длительностью 5–60 мин, в течение которых осуществляется седиментация частиц SiO<sub>2</sub> на никелевую основу в отсутствие тока, без перемешивания электролита. Затем включали ток на заданное время для гальванического заращивания частиц SiO<sub>2</sub> на никелевой основе.

Состав электролита для осаждения композита,  $\Gamma \cdot \pi^{-1}$ : NiSO<sub>4</sub>·7 H<sub>2</sub>O - 150; Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>·5 H<sub>2</sub>O - 25; H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> - 15; KCl - 10; SiO<sub>2</sub> - 2; pH 5÷6.

 $S_{\text{катод}}$ :  $S_{\text{анод}} = 1$ : 20;  $i_{\text{катод}} = 1,5-2,0 \text{ мА·см}^{-2}$ . Термообработка: 105°С, 6–7 ч.

 $S_{\text{катод}}$ ,  $S_{\text{анод}}$  – катодная, анодная площадь, см<sup>2</sup>;  $i_{\text{катод}}$  – катодная плотность тока.

#### Характеристики исследуемых продуктов

Синтезированные продукты исследовали с помощью рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии, а также электрохимически.

Структуру SiO<sub>2</sub> и композита определяли на дифрактометре ДРОН-2 в Си К<sub>а</sub>-излучении; морфологию поверхности – в электронном микроскопе; электрохимические (**JMB-100**) характеристики \_ В гальваностатическом разрядно-зарядном циклировании с использованием испытательного стенда с компьютерным программным обеспечением в макетном литиевом аккумуляторе в габаритах 2016. Макет заполняли электролитом: диметоксиэтан (Merck), 1 моль.л<sup>-1</sup> лиоксолан (Acros). LiBF<sub>4</sub> (Advanced research chemicals). Сборку макетов проводили в перчаточном боксе в атмосфере сухого аргона.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Известно о существовании 16 модификаций SiO<sub>2</sub> [11]. Они могут быть в аморфной или кристаллической форме, обладать различной термической устойчивостью, растворимостью, химической и электрохимической активностью и различиями в других свойствах. В публикациях не всегда представлены характеристики исходного диоксида SiO<sub>2</sub>, что приводит к затруднению объяснения различного электрохимического поведения его в литиевом аккумуляторе. Поэтому информация об исходном исследуемом материале является очень важной.

Синтезированный диоксид SiO<sub>2</sub>, используемый в данной работе, характеризуется параметрами: массовая часть влаги 6,2%, массовая часть потерь при прокаливании 5,56% (900°С, 2 ч), удельная поверхность по азоту 202 м<sup>2</sup>·г<sup>-1</sup>, насыпная плотность 220 г·дм<sup>-3</sup> (для уплотненной массы).

В соответствии с гистограммой распределения частиц диоксида  $SiO_2$  по размерам их максимальный размер не превышает 22 нм и в основной доле достигает 12÷16 нм (рис. 1).



**Рис. 1.** Гистограмма распределения частиц по размерам диоксида SiO<sub>2</sub>. *l* – размер частицы (нм); % – содержание частиц данного размера; *G* – распределение по Гауссу.

Частицы диоксида SiO<sub>2</sub> имеют вполне определенную форму квадратов со слегка округленными углами (рис. 2).



**Рис. 2.** Микрофотографии образцов SiO<sub>2</sub> в электронном микроскопе.

По данным рентгенофазового анализа, синтезированный диоксид SiO<sub>2</sub> принадлежит аморфной модификации (рис. 3).



**Рис. 3.** Рентгеновская дифрактограмма SiO<sub>2</sub>: I – интенсивность (имп·с<sup>-1</sup>); 2 $\theta$  – угол Брэгга (град).

# Электрохимические характеристики композитов SiO<sub>2</sub>/Ni

Композит SiO<sub>2</sub>/Ni осаждали на основе из никеля, который обычно в атмосфере воздуха быстро покрывается тонкой оксидной пленкой. Оксиды никеля, синтезированные в тонких слоях электролизом, проявляют электрохимическую активность в редокс-реакции с Li<sup>+</sup> [12]. Разрядный профиль оксида никеля NiO<sub>x</sub> в литиевом аккумуляторе зависит от содержания кислорода. При x = 1 средний разрядный потенциал оксида NiO находится вблизи 1,4 В относительно Li/Li<sup>+</sup>. Разрядный потенциал нестехиометрического оксида никеля (x < 1) в литиевом аккумуляторе в интервале 2÷0 В изменяется монотонно.

Никелевая основа, используемая для осаждения тонкослойного композита SiO<sub>2</sub>/Ni, была предварительно покрыта тонким слоем гальванического никеля и исследована в макетном литиевом аккумуляторе (рис. 4а–в).

Разрядная емкость Ni-основы в первом цикле значительно превышает таковую в последующих (2÷16) циклах, в которых снижается до 5÷10% емкости, отданной в первом цикле. Это свидетельствует о необратимости процесса взаимодействия оксидного поверхностного слоя никелевой основы с литием и его низкой разрядной емкости.

Разрядно-зарядные кривые синтезированных композитов  $SiO_2/Ni$  в литиевом аккумуляторе зависят от технологических параметров синтеза, в частности, от времени предварительной седиментации диоксида кремния на подложку без тока (5, 15, 20 мин), определяющего массовое содержание  $SiO_2$  в композите, а также времени последующего гальванического осаждения никеля в зависимости от плотности тока.



**Рис. 4.** Разрядно-зарядные кривые никелевой основы размером (1×1) см, используемой для синтеза композита SiO<sub>2</sub>/Ni в макетном литиевом аккумуляторе.  $i_{\text{разр}} = i_{\text{заряд}} = 0,03 \text{ мA} \cdot \text{см}^{-2}$ . E – напряжение (B); Q – емкость (мA·ч). Те же обозначения рис. 5–10.

На рис. 5 представлены разрядно-зарядные характеристики в Li-аккумуляторе композита  $SiO_2/Ni$ , синтезированного при времени седиментации диоксида кремния на подложку 5 мин и гальваническом осаждении никеля 20 мин, при плотности тока 1,5 мA·см<sup>-2</sup>.



**Рис. 5.** Разрядная кривая композита SiO<sub>2</sub>/Ni, полученного на Ni-основе  $(1 \times 1 \text{ см}^2)$ , при длительности седиментации 5 мин (1-й цикл). На вставке: разрядно-зарядные кривые в 3- и 4-м циклах.

Разрядные E-Q-кривые никелевой основы (рис. 4а) и композита SiO<sub>2</sub>/Ni (рис. 5) в первом цикле имеют однотипный монотонно ниспадающий профиль. В первом цикле в обоих случаях происходит образование на электродной поверхности твердоэлектролитной пленки SEI (Solid Electrolyte Interface) в результате взаимодействия электродного материала с апротонным электролитом. E-Q-кривые образцов основы и композита отличаются величиной разрядной емкости.

Поверхностная Ni-оксидная пленка на никелевой основе обладает незначительной обратимой емкостью в редокс-реакции с литием (рис. 6,

кривая 3a) по сравнению с таковой композита SiO<sub>2</sub>/Ni (рис. 6, кривые 3, 14).



**Рис. 6.** Сравнение разрядных кривых композита SiO<sub>2</sub>/Ni (3, 14) в 3- и 14-м циклах и никелевой основы (3а) в 3-м цикле в литиевом аккумуляторе.

Во 2÷14-м циклах разрядная емкость композита SiO<sub>2</sub>/Ni составляет около 0,4 мА·ч·см<sup>-2</sup>, что свидетельствует об удовлетворительной обратимости процесса электрохимического взаимодействия композита с литием при незначительном эффекте никелевой основы.

Разрядно-зарядные характеристики композитов SiO<sub>2</sub>/Ni с более высоким содержанием SiO<sub>2</sub> (рис. 7), полученных при электрохимическом осаждении со временем седиментации SiO<sub>2</sub>, равным 15 и 20 мин, отличаются от представленных разрядно-зарядных характеристик композита с продолжительностью седиментации 5 мин.

На кривых рис. 7 начальный горизонтальнонаклонный участок вблизи 1,4 В соответствует электрохимическому превращению оксида никеля. Эффект его уменьшается с повышением времени седиментации диоксида кремния, соот-



**Рис. 7.** Сравнение разрядных кривых композитов SiO<sub>2</sub>/Ni в первом редокс-процессе с литием в зависимости от длительности седиментации SiO<sub>2</sub>, мин: (a) 15; (б) 20.

ветствующего большему участию в электродном процессе  $SiO_2$ , чем поверхностного оксида никеля. По достижении 0,25 В на разрядной кривой  $SiO_2/Ni$ -электрода наблюдается всплеск внезапного подъема напряжения, свидетельствующий о снижении поляризационного сопротивления композитного электрода, который, исходя из литературных данных, объясняется внезапным образованием хорошо проводящего ортосиликата лития Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>.

Горизонтальный участок разрядной кривой после наблюдаемого всплеска определяется электрохимическим взаимодействием диоксида кремния с литием на фоне незаметной доли участия оксида никеля.

Изменение в разрядной кривой композитного образца на рис. 7а с изменением плотности тока (13, 51, 100 мк $A \cdot cm^{-2}$ ) показано на рис. 8. И оно, как видно, незначительное при переходе от плотности тока 51 до 100 мк $A \cdot cm^{-2}$ . Одной из причин этого может быть снижение сопротивления электродного материала по мере литирования.



Рис. 8. Изменения разрядной кривой с рис. 7а с изменением плотности разрядного тока.

Разрядно-зарядное циклирование композита осуществляется стабильно при низкой плотности зарядного и разрядного токов и неглубоком разряде, как приведено на рис. 9.

При более глубоком зарядно-разрядном процессе (повышении степени заряженности и разряженности) и снижении  $E_{\text{разр}}$  ниже 0,1 В возникают деградационные процессы, связанные с объемным расширением оксидного материала. О возникновении деградационного процесса

может свидетельствовать разрывность разряднозарядных кривых – наличие на них флуктуаций, происходящих в результате фрагментации электродного материала с потерей механической цельности электрода (рис. 10).



**Рис. 9.** Разрядно-зарядные кривые композита SiO<sub>2</sub>/Ni в 8-м цикле при неглубоком разряде:  $i_{\text{разр}} = i_{\text{заряд}} = 0.03 \text{ мA} \cdot \text{сm}^{-2}$ . l – разряд; 2 – заряд.



Рис. 10. Разрядно-зарядные кривые композита SiO<sub>2</sub>/Ni при повышении степени заряженности/разряженности композита SiO<sub>2</sub>/Ni в 10-м цикле: *1* – разряд; *2* – заряд.

Флуктуации на зарядных кривых композита  $SiO_2/Ni$  усиливаются при повышении зарядной плотности тока от 30 до 80 мкА·см<sup>-2</sup> (рис. 11, кривая 2).

Известно, что в электродах на основе кремния и его оксидов размерные изменения в горизонтальном и вертикальном направлениях, происходящие при циклировании в литиевом аккумуляторе, отличаются друг от друга. В них возникает механическая напряженность.

Формирование новых фаз при циклировании Si-содержащих электродов способствует также развитию негомогенных объемных изменений. Происходят разрыв электронно-ионного транспортного пути, повышение внутреннего сопротивления электрода, а также разрыв поверхностной защитной твердоэлектролитной пленки SEI на кремниевом оксиде. Плотная пленка, предотвращающая побочные процессы, приводящие к потреблению лития, непрерывно обновляясь при разрыве, становится нестабильной. Механический стресс приводит к разрушению частиц, измельчению материала, потере контакта между его частицами, нарушению цельности электрода, падению разрядной емкости.



**Рис. 11.** Разрядно-зарядные кривые композита SiO<sub>2</sub>/Ni при повышении плотности зарядного тока:  $i_{\text{заряд}} = 0,08 \text{ мA} \cdot \text{сm}^{-2}$ .

В результате фрагментации электрода в делитировании (рис. 11, кривая 2), приводящей к повышению его внутреннего сопротивления, разрядная кривая снижается в область сплавления Si, образованного при циклировании композита, с литием (от 0,1 В и ниже), приближаясь к потенциалу осаждения лития (рис. 11, кривая I), после достижения которого в дальнейшем осуществляется циклирование лития (осаждениерастворение). Система (SiO<sub>2</sub>/Ni)/Li становится не способной к обратимому электрохимическому преобразованию.

При анализе литературных данных и результатов данной работы становятся понятными причины существующего расхождения в разрядно-зарядных кривых взаимодействия диоксида кремния с литием, представленные в источниках информации.

В тонких пленках с минимальной активной массой, как в случае с электродом SiO<sub>2</sub>/Ni, полученным в данной работе при продолжительности седиментации диоксида кремния 5 мин, а также в работе [9] с SiO<sub>2</sub>-электродом, активная масса которого равна 0,11 мг·см<sup>-2</sup>, в определении профиля разрядно-зарядных кривых существенную роль играет основа электрода. В первом случае – это оксидные соединения на поверхности никеля, во втором – оксидные соединения металлов, входящих в состав нержавеющей стали, образованные на поверхности основы.

В указанных случаях наблюдается эффект соучастия в электродном процессе активной компоненты (SiO<sub>2</sub>) и оксидов основы, а также, возможно, продуктов их взаимодействия. Поэтому интервал потенциалов активности SiO<sub>2</sub>/Ni-электрода довольно расширенный (2,00÷0,01 B).

Подобное взаимодействие оксидов основы (нержавеющей стали) с литием показано в исследованиях тонкослойного LiCoO<sub>2</sub>-электрода в макетном литиевом аккумуляторе [13].

Роль активного SiO<sub>2</sub>-материала становится превалирующей при увеличении степени наполнения им никелевой основы в исследуемом композитном электроде, что наблюдается при увеличении времени седиментации диоксида кремния. Тогда электрохимическая активность тонкослойного SiO<sub>2</sub>/Ni-электрода проявляется в интервале напряжения **V3КОМ** между 0,40-0,01 В. В этом случае возможно достижение высоких разрядных характеристик по емкости (более 20 мА·ч·см<sup>-2</sup>), соизмеримых с характеристиками, определенными авторами с более энергоемким кремниевым электродом, но полученным по технически более сложному способу фотоэлектрохимического травления шайб монокристаллического *п*-кремния [14].

Оптимальным режимом гальванического осаждения композита SiO<sub>2</sub>/Ni можно считать: длительность седиментации SiO<sub>2</sub> без тока – 12–20 мин, длительность гальванического осаждения – 20 мин,  $i_{\text{кат}} = 1,5-2,0 \text{ мA} \cdot \text{см}^{-2}$ . При повышении длительности гальванического осаждения до 60 мин SiO<sub>2</sub> на основе зарастает беспористым никелем, и электрохимическая активность композита не проявляется в литиевом аккумуляторе.

Гигроскопический  $SiO_2$ , оводненный электролите осаждения композита, покрывается в гальваническом процессе никелем, образуя гомогенную сетку пор в никелевой матрице при последующей термообработке композита за счет потери влаги оводненными частицами SiO2. В литиевом источнике тока заполненное электролитом поровое пространство никелевой матрицы обеспечивает эффективный перенос зарядов к отдельным частицам активного материала, что обусловливает горизонтальную направленность зарядно-разрядных кривых и стабильность циклирования макетного литиевого аккумулятора в интервале напряжения 0,40-0,20 В.

Для продолжительного стабильного циклирования SiO<sub>2</sub>/Ni-электрода с высокой кулоновской эффективностью важно четко ограничить рабочий интервал напряжения циклирования, не допуская образования фаз, связанных с существенным объемным расширением. Это нетрудно сделать, воспользовавшись достоинством разрядно-зарядных кривых исследуемого композита – постоянством рабочего напряжения в течение продолжительного времени в процессах заряда и разряда.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложен способ синтеза тонкослойного композитного SiO<sub>2</sub>/Ni-электрода, в котором аморфный нанометровый диоксид кремния, полученный сернокислотным осаждением из водного раствора Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>·mH<sub>2</sub>O, заключен в никелевую матрицу электролизом с целью эффективного использования в отрицательных электродах литий-ионного микроаккумулятора. Первые полученные результаты свидетельствуют о гомогенном распределении диоксида SiO<sub>2</sub> в матрице, обеспечивающего доступный транспорт зарядов к его отдельным частицам, что способствует строго горизонтальной направленности разрядно-зарядных (E-Q)-кривых SiO<sub>2</sub>/Ni-электрода и стабильности циклирования в макетном литиевом аккумуляторе. Установлен интервал напряжения в аккумуляторе (SiO<sub>2</sub>/Ni)/Li, равный 0,40-0,15 В, позволяющий получать разрядную емкость (1-20 мА·ч·см<sup>-2</sup>), необходимую для эффективного использования композита в литийионных микроаккумуляторах.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Tu J., Yuan Y, Zhan P., Jiao H. et al. *J Phys Chem C*. 2014, **118**, 7357–7362.
- Xun S., Song X., Wang L., Grass M.E. et al. *J Electrochem Soc.* 2011, **158**(12), A1260–A1266.
- Huang H., Kelder E.M., Chen L., Schoonman J. J Power Sources. 1999, 81, 362–367.
- 4. Saint J., Morcrette M., Larcher D., Laffont L. et al. *Advanc Func Mater*. 2007, **17**(11), 1765–1774.

- Graetz J., Ahn C.C., Yazami R., Fultz B. *Electrochem Solid-State Lett.* 2003, 6(9), A194–A197.
- Guo B., Shu J., Wang Z., Yang H. et al. *Electrochem Commun.* 2008, **10**(12) 1876–1878.
- 7. Chang Won-Seok, Park Cheol-Min, Kim Jae-Hun, Kim Young-Ugk et al. *Ener Env Sci.* 2012, **5**, 6895–6899.
- 8. Sasidharan M., Liu D., Gunawardhana N., Yoshio M. et al. *J Mater Chem.* 2011, **21**, 13881–13888.
- 9. Sun Qian, Zhang Bing, Fu Zheng-Wen. *Appl Surf Sci.* 2008, **254**, 3774–3779.
- 10. Maciyevskyi N.A., Apostolova R.D., Savchenko M.O., Pieskov R.P. et al. *Promising materials and processes in technical electrochemistry*, Monograph, Kyiv, 2016, 68–72.
- 11. Айлер Р. *Химия кремнезема*. М.: Мир, 1982. 1126 с.
- 12. Шембель Е.М., Апостолова Р.Д., Нагирный В.М. Электрохимия. 2004, **40**(1), 45–53.
- 13. Апостолова Р.Д., Нагирный В.М., Шембель Е.М. Электрохимия. 1998, **34**(7), 778–784.
- Астрова Е.В., Федулова Г.В., Смирнова И.А., Ременюк А.Д. и др. Письма в Журнал технической физики. 2011, 37(15), 87–93.

#### Поступила 29.03.17

#### Summary

Silicon dioxide was produced by deposition from  $Na_2SiO_3 \cdot mH_2O$  aqueous solution. The particle size of the main faction of the synthesized material, determined in an electron microscope, is in a range of 12–16 nm. On the data of the XRD patterns,SiO<sub>2</sub> of amorphous modification was obtained. Then it was used for production of a thin-layer SiO<sub>2</sub>/Ni composite by electrolysis for application in negative electrodes of miniature lithium-ion batteries (LIB). The investigations of SiO<sub>2</sub>/Ni composite in a prototype of a Li-accumulator by the galvanostatic mode show the stable cycling in the voltage of 0.40–0.15 V as evidence of the perspective of its usage in LIB.

Keywords:  $SiO_2$ dioxide, amorphous modification, nanometer  $SiO_2$ /Ni composite, electrolysis, lithium battery.